S	earch Notes	

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/040,915	TEIG ET AL.	
Examiner	Art Unit	
A. M. Thompson	2825	

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
. 716	12	6/1/2005	AMT
716	13	6/1/2005	AMT
716	14	6/1/2005	AMT
716	15	6/1/2005	AMT
	_		
			!
	•		
		•	

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner

SEARCH NC (INCLUDING SEARCH		)
	DATE	EXMR
USPAT; USPGPUB; DERWENT	6/1/2005	AMT
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		!